

应用几种谱仪测定大量 ^{242}Cm 中的少量 ^{241}Am

@乔盛忠 @佟伯庭 @吕峯 @朱荣保 @杨留成 @徐颖璞

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本文介绍了用Si(Li)谱仪,Ge(Li)谱仪和 α - γ 符合谱仪测定大量 ^{242}Cm 中少量 ^{241}Am 杂质的方法。描述了三种方法的特点,并比较了它们的测量灵敏度和准确度。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(342KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者